

(付録)

半導体技術ロードマップ専門委員会 外部発表リスト
(平成18年度実績)

(1) 2006年5月

発表形態 : 執筆/掲載
 掲載日 : 平成18年(2006年)5月
 執筆者 : 石内 秀美 (STRJ 委員長)
 タイトル : 「ITRS 2005 の概要」
 掲載誌名 : SEAJ 5月号
 刊行団体名 : SEAJ

(2) 2006年5月

発表形態 : 講演
 講演日 : 平成18年(2006年)5月19日
 講演者 : 柿本 勝 (WG1)
 講演タイトル : 「大規模SoCの設計を実現する上流設計の現状と課題」
 講演会名称 : SoC/SiPデベロッパーズコンファレンス2006
 講演場所 : 東京コンファレンスセンター品川
 主催団体名 : 日経BP社 日経マイクロデバイス

(3) 2006年5月

発表形態 : 執筆/掲載
 掲載日 : 平成18年(2006年)5月
 執筆者 : 浅田 善己 (設計TF)
 タイトル : 「今だから学ぶ基礎講座 「90nm プロセスの LSI」はどの部分が 90nm なのか」
 掲載誌名 : 日経エレクトロニクス
 刊行団体名 : 日経BP社

(4) 2006年6月

発表形態 : 講演
 講演日 : 平成18年(2006年)6月13日
 講演者 : 山崎 治 (WG4)
 講演形式 : セッションチェアとして、オープニングでのセッション内容紹介
 講演会名称 : SEMI FORUM JAPAN 2006 多層配線技術セミナー
 主催団体名 : SEMI

(5) 2006年9月

発表形態 : 講演
 講演日 : 平成18年(2006年)9月27日
 講演者 : 佐藤 正幸 (WG2)
 講演タイトル : 「ファブレス向けテスト・ソリューションとインターネット・サービス」
 講演会名称 : JASVA 特別講演 (JASVA Tokyo Day)

講演場所 : 如水会館
主催団体名 : JASVA

(6) 2006年9月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成18年(2006年)9月29日
講演者 : 石内 秀美 (STRJ委員長)
講演タイトル : 「パラダイムシフト ‘45’ 微細化からの回答」
講演会名称 : JST フォーラム
講演場所 : 自動車会館(市ヶ谷)
主催団体名 : サイエンスフォーラム

(7) 2006年9月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成18年(2006年)9月29日
講演者 : 長田 俊彦 (STRJ副委員長)
講演タイトル : 「パラダイムシフト ‘45’ 45cm工場移行の経済性」
講演会名称 : JSTフォーラム
講演場所 : 自動車会館(市ヶ谷)
主催団体名 : サイエンスフォーラム

(8) 2006年10月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成18年(2006年)10月11日
講演者 : 佐藤 康夫 (WG2)
講演タイトル : 「テストを取り巻く DFX の様々な展望」
講演会名称 : ISTF(Industry Strategy and Technology Forum)2006
講演場所 : パシフィコ横浜
主催団体名 : SEAJ/SEMI *JEITA 等 協賛

(9) 2006年12月

発表形態 : 執筆/掲載
掲載日 : 平成18年(2006年)12月
執筆者 : 津金 賢 (WG11)
タイトル : 「ITRS ロードマップにおける Wafer Environmental Contamination Control(WECC)」
掲載誌名 : クリーンテクノロジー
刊行団体名 : 日本工業出版株式会社

(10) 2006 年 12 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成18年(2006年) 12月6日
講演者 : 長田 俊彦 (STRJ副委員長)
講演タイトル : 「半導体生産性改善の経済性(450mmと300mmプライム)」
講演会名称 : SEMI STS(SEMICON Technical Symposium)
講演場所 : 幕張メッセ国際会議場
主催団体名 : SEMI Japan

(11) 2006 年 12 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成18年(2006年) 12月7日
講演者 : 佐藤 正幸 (WG2)
講演タイトル : 「テスト言語の調査とテスト構造表現言語」
講演会名称 : SEMI STS(SEMICON Technical Symposium)
講演場所 : 幕張メッセ国際会議場
主催団体名 : SEMI Japan

(12) 2007 年 2 月

発表形態 : 執筆/掲載
掲載日 : 平成19年(2007年) 2月
執筆者 : 石内 秀美 (STRJ委員長)
タイトル : 「ITRS 2006 Update の概要」
掲載誌名 : JEITA Review 2月号
刊行団体名 : JEITA

(13) 2007 年 3 月

発表形態 : 執筆/掲載
掲載日 : 平成19年(2007年) 3月
執筆者 : 伊藤 修一 (WG2)
タイトル : 「メモリ混載 LSI テスティング技術」
掲載誌名 : 半導体テクノロジー大全(2007年版)
刊行団体名 : 株式会社 電子ジャーナル